Observation multi-technique de l'endommagement de polyimides pour un nouveau profileur faisceau ultra-mince

G. Pipelier¹, L. Bernardi², G. Blain³, E. Delagnes⁴, F. Gebreyohannes⁴, Y. Geerebaert², O. Gevin⁴, F. Haddad^{1,3}, C. Koumeir^{1,3}, G. Louarn⁵, F. Magniette², P. Manigot², F. Poirier¹, N. Servagent³, T. Sounalet³, C. Thiebaut², M. Verderi²

¹GIP ARRONAX/Nantes/France, ²LLR/CNRS-Ecole Polytechnique/Palaiseau/France, ³Laboratoire SUBATECH/IMT Atlantique/Nantes/France, ⁴IRFU/CEA/Université Paris-Saclay/Gif-sur-Yvette/France, ⁵IMN/Université de Nantes/Nantes/France

Contexte

PEPITES est un nouveau moniteur faisceau ultra-mince, conçu pour mesurer les propriétés de faisceaux de particules chargés (intensité, position, profil) avec une perturbation minimale. Il équipera les lignes du cyclotron ARRONAX (Saint-Herblain, 44800). Malgré ses excellentes propriétés, son endommagement dû aux radiations est inévitable et doit être caractérisé et quantifié. La mise en place d'un protocole d'analyse se fera par l'étude du Kapton de 8 µm (DuPont)

Présentation du détecteur

L'endommagement

- Malgré le faible LET des protons de haute énergie dans des polyimides radiorésistants comme le Kapton (1keV/µm), de nombreuses interactions se produisent
- L'interaction des protons avec les polymères provoque des ruptures de liaisons et des scissions générant des radicaux libres dans les chaînes de polymères
- Ces radicaux libres vont modifier les propriétés du matériau et créer du dégazage.

- La mise en place du protocole de mesure de l'endommagement se fera d'abord par l'étude du Kapton.

Dispositif expérimental

- Energie** : 70 MeV Protons
- Intensité** : 100 nA - 2000 nA
- Fluence** : <math>< 7.10^{15}</math> H⁺.cm⁻²

4 échantillons en CP1 dont 2 avec des bandes d'or
Sortie de ligne faisceau

Observation de surface

- Microscopie Optique (MO)
- Microscopie Electronique à Balayage (MEB)
- Microscopie à Force Atomique (AFM)

- Les images suivantes illustrent l'endommagement de surface du Kapton irradié à une fluence de 7.10¹⁵ H⁺.cm⁻² au MO et à l'AFM
- Le diamètre de la tache faisceau est de 8 mm
- On observe la formation de défauts sphériques (blister) :
  - Diamètre moyen : quelques µm
  - Hauteur moyenne : ~ 100 nm
  - Nombre de défauts : ~10⁵ Blister.cm⁻²

Analyse de surface

- L'analyse de l'AFM montre une hauteur moyenne de l'échantillon plus importante au niveau de la tache faisceau pour les échantillons irradiés
- Cette augmentation est liée à la présence de blisters au niveau de la tache faisceau qui seraient produits par le dégazage du CO
- Une augmentation de la dose se traduit par une augmentation de la hauteur moyenne des blisters et également une augmentation du nombre de blister par unité de surface

Futures analyses du CP1

- Chimique** :
  - Spectroscopie Infra-rouge (FTIR)
  - Spectrométrie photoélectronique X (XPS)
- Electrique** :
  - Mesure de conductivité

Le projet PEPITES est supporté par l'Agence Nationale de la Recherche, ANR-17CE31-0015, ANR-11-EQPX-0004 et le LABEX P210